

# Квантовые поправки к проводимости 2D-дырок в квантовой яме на кристаллографической поверхности теллура (10 $\bar{1}0$ )

© Н.С. Аверкиев, В.А. Березовец, Г.Е. Пикус, Н.И. Саблина, И.И. Фарбштейн

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступила в Редакцию 13 февраля 1998 г.)

Проведен анализ эффекта аномального положительного магнетосопротивления 2D-слоя на поверхности теллура с кристаллографическими индексами (10 $\bar{1}0$ ) и показано, что он может быть описан в рамках теории слабой локализации, учитывающей особенности симметрии зонного спектра двумерного слоя на данной поверхности теллура и связанные с этим особенности процессов релаксации фазы, а также наличие нескольких 2D-подзон. Определены основные параметры теории и обнаружено, что для данной ориентации 2D-слоя характерна необычно высокая вероятность межподзонных переходов при упругом рассеянии, что качественно отличает этот случай от системы 2D-дырок на ранее изученной поверхности (0001). Эффект связывается с различием в характере электронных состояний на этих границах кристалла: оборванные ковалентные связи в цепочках, образующих кристалл теллура, на поверхности (0001) и нарушение более слабых связей типа Ван-дер-Ваальса между цепочками в случае поверхности (10 $\bar{1}0$ ), являющейся поверхностью скола. Сделан вывод о том, что время сбоя фазы волнового состояния при неупругих процессах обусловлено межэлектронным рассеянием.

Квантовые поправки к проводимости двумерных (2D) дырочных носителей заряда на поверхности теллура были впервые обнаружены при исследовании гальваномагнитных свойств аккумулирующего слоя (АС) на поверхности теллура с кристаллографической ориентацией (0001) [1]. Эффект проявил себя как аномальное магнетосопротивление (АМС), знак и характер которого изменялись с температурой и концентрацией 2D-дырок. Экспериментальные результаты были количественно объяснены в рамках теории слабой локализации (СЛ) невзаимодействующих между собой частиц, модифицированной путем учета особенностей энергетического спектра валентной зоны теллура (снятое спиновое вырождение, многодолинность, тригональное искажение спектра) [1,2]. Позднее положительное АМС было обнаружено при исследовании АС на поверхности (10 $\bar{1}0$ ), параллельной осям второго ( $x$ ) и третьего ( $z$ ) порядков [3,4]. Эффект также интерпретировался в феноменологических терминах теории СЛ, но при этом не была учтена реальная симметрия поверхности Ферми 2D-дырок на этой плоскости; в частности, предполагалось отсутствие тригонального искажения спектра.

В последнее время построена микроскопическая теория эффекта слабой локализации для 2D-дырок в теллуре, локализованных у основных кристаллографических поверхностей с индексами (0001), (1 $\bar{2}\bar{1}0$ ), (10 $\bar{1}0$ ). Эта теория учитывает как реальную анизотропную зонную структуру теллура и зависимость дисперсии 2D-дырок от ориентации поверхности, так и зависимость матричного элемента рассеяния от начального и конечного квазиимпульсов дырок [5,6]. Кроме того, рассмотрены особенности СЛ, возникающие при наличии в квантовой яме нескольких размерно-квантованных подзон.

В настоящей работе представлены результаты исследования АМС на поверхности (10 $\bar{1}0$ ) теллура и их сопо-

ставление с развитой для этой ориентации теорией СЛ. При анализе использованы характеристики 2D-дырок, найденные по результатам измерений монотонной и осциллирующей составляющих сопротивления и эффекта Холла в 2D-слое (эффект Шубникова–де Гааза (ШГ)) в широком диапазоне магнитных полей [7].

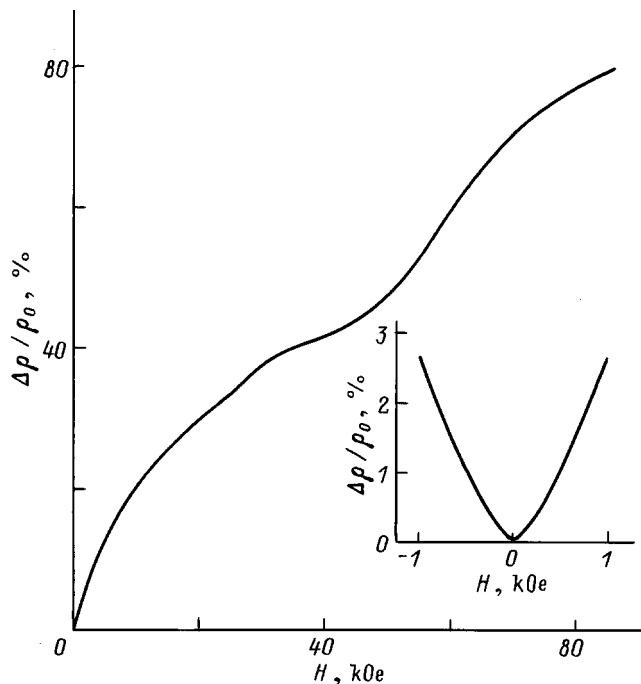
## 1. Экспериментальные результаты

Образцы выкалывались вдоль оси  $C_3$  из монокристалла теллура рекордной чистоты ( $10^{13} \text{ cm}^{-3}$  при 77 К) и представляли собой прямоугольные пластинки толщиной 0.1–0.4 мм с широкой гранью, соответствующей плоскости скола (кристаллографическая плоскость (10 $\bar{1}0$ )). АС на широкой грани создавался обработкой полирующим травителем по той же методике, что и для поверхности (0001) [1].

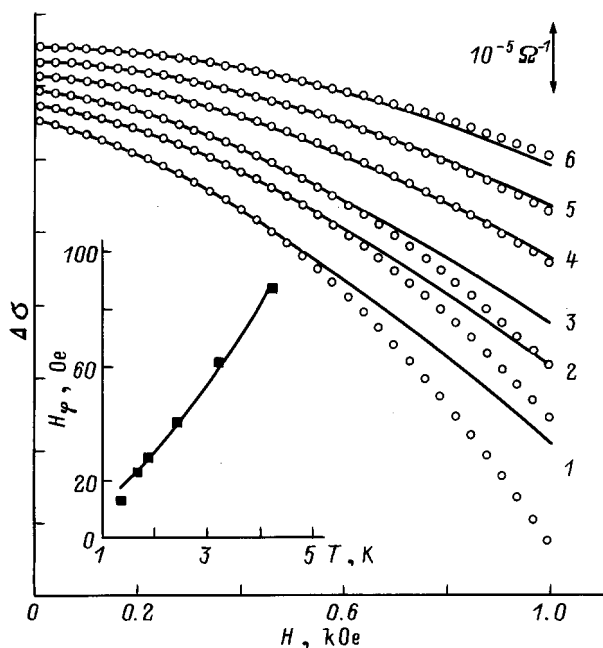
Типичные результаты измерения магнетосопротивления  $\Delta\rho/\rho_0$  образца с АС на плоскости (10 $\bar{1}0$ ) в магнитных полях до 100 кОе представлены на рис. 1. Осцилляционная зависимость  $\Delta\rho(H)/\rho_0$  (эффект ШГ) свидетельствует о вырожденном состоянии 2D-дырочного газа. Анализ поведения  $\Delta\rho(H)/\rho_0$  в широком диапазоне магнитных полей, проведенный в [7], позволил определить такие его характеристики, как число 2D-подзон в АС

Характеристики 2D-дырок в АС на поверхности (10 $\bar{1}0$ ) теллура

Квантовый номер подзоны	$p_l,$ $10^{12} \text{ cm}^{-2}$	$\mu_{zz}^l,$ $10^3 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$	$\Omega_l,$ $10^{13} \text{ eV}^{-1}$	$D_{zz}^l,$ $\text{cm}^2/\text{s}$	$(\tau_0^0)^l,$ $10^{-13} \text{ s}$
0	4.0	5.5	3.66	600.8	4.44
1	0.54	12.0	8.54	75.85	24.4



**Рис. 1.** Зависимость магнетосопротивления  $\Delta\rho(H)/\rho_0$  образца теллура с АС на поверхности  $(10\bar{1}0)$  от магнитного поля при  $T = 1.3$  К. На вставке — начальный участок зависимости  $\Delta\rho(H)/\rho_0$ . Видно anomalно быстрое возрастание сопротивления вблизи  $H = 0$ .



**Рис. 2.** Зависимость изменения проводимости образца теллура с АС на поверхности  $(10\bar{1}0)$  от магнитного поля  $\Delta\sigma(H)$  при разных температурах. Проводимость рассчитана на единицу площади. Начало кривых сдвинуто. Сплошная линия — эксперимент, светлые кружки — расчет.  $T$  (К): 1 — 1.35, 2 — 1.67, 3 — 1.86, 4 — 2.4, 5 — 3.2, 6 — 4.2. На вставке — зависимость параметра  $H_\phi$  от температуры: темные квадраты — эксперимент, сплошная линия — аппроксимация.

(две), концентрацию 2D-дырок в каждой подзоне  $p_i$  и их подвижность  $\mu_{zz}^i$  (см. таблицу).

На врезке к рис. 1 выделен в увеличенном масштабе начальный участок представленной зависимости. Видно, что в области слабых магнитных полей зависимость  $\Delta\rho(H)/\rho_0$  имеет аномальный вид, характерный для эффекта слабой локализации: резкое почти линейное возрастание, начинающееся при магнитном поле порядка 20 Ое.

На рис. 2 представлена зависимость  $\Delta\sigma(H)$  при разных температурах в области проявления АМС.

## 2. Обсуждение результатов

1) Закон дисперсии 2D-дырок на поверхности  $(10\bar{1}0)$ . В теллуре экстремумы валентной зоны и зоны проводимости расположены в углах зоны Бриллюэна  $M$  и  $P$ , связанных только операцией инверсии времени. В трехмерном случае закон дисперсии для верхней валентной зоны с точностью до членов порядка  $k^3$  может быть представлен в виде [8]

$$E = A_v k_z^2 + B_v (k_x^2 + k_y^2) - (\Delta^2 + \beta^2 k_z^2)^{1/2} + \Delta + (1/2)\gamma_3 (k_+^3 + k_-^3), \quad (1)$$

где  $k_\pm = k_x \pm ik_y$ . Константа  $\gamma_3$  имеет разные знаки для экстремумов  $M$  и  $P$ . Параметры, входящие в (1), таковы, что в спектре валентной зоны имеется мелкая седловая точка, отстоящая от максимума зоны на величину  $E_0 = 2.3$  meV. Использование двузонной модели, учитывающей  $kp$ -взаимодействие двух верхних валентных подзон с зоной проводимости и нижней валентной подзоной, позволяет связать параметры, входящие в (1), с шириной запрещенной зоны  $E_g$  и величиной спин-орбитального расщепления валентной зоны  $\Delta_1$  [5,6].

При размерном квантовании вдоль оси  $y$  в потенциальной яме на поверхности  $(10\bar{1}0)$  теллура закон дисперсии для 2D-дырок в размерно-квантованной подзоне с индексом  $l$  приобретает вид [6]

$$E_l(k_x, k_z) = A_v k_z^2 + B_v k_x^2 - (\Delta^2 + \beta^2 k_z^2)^{1/2} + \Delta + \gamma_3 k_x (k_x^2 - 3\langle k_y^2 \rangle), \quad (2)$$

где  $\langle k_y^2 \rangle$  — функция, зависящая от формы потенциальной ямы и номера уровня размерного квантования  $l$ .

Поверхность Ферми для 2D-дырок в соответствии с (2) для малых энергий представляет собой два близко расположенных эллипса, которые при  $E_F = E_0$  смыкаются, образуя при дальнейшем увеличении  $E_F$  гантелеобразную фигуру. Как видно из (2), в 2D-слое на поверхности  $(10\bar{1}0)$  сохраняется тригональное искажение траекторий Ферми, не учтенное в [3].

Наличие седловой точки в спектре приводит не только к сильной анизотропии эффективной массы 2D-дырок, меняющейся при изменении энергии Ферми, но и к

необычной зависимости плотности состояний  $2D$ -дырок от энергии  $\Omega(E)$ , изображенной на рис. 3 в расширенном по сравнению с [5,6] диапазоне концентраций. Увеличение плотности состояний при приближении к энергии седловой точки приводит к усилению роли в кинетических эффектах размерно-квантованных подзон с энергией Ферми, близкой к энергии  $E_0$ , число свободных носителей в которых сравнительно невелико.

2) Эффект слабой локализации на поверхности теллура  $(10\bar{1}0)$ . Случай сильной анизотропии эффективной массы и наличия нескольких размерно-квантованных подзон. Как показано в [5,6], в рамках теории слабой локализации невзаимодействующих между собой частиц зависимость проводимости  $2D$ -дырок на поверхности теллура  $(10\bar{1}0)$  от магнитного поля после учета анизотропных свойств коэффициента диффузии приводится к стандартной форме

$$\Delta\sigma_{ii}(H) = \sigma_0 \left\{ f_2 \left( \frac{H}{H_\varphi + H_v + H_\gamma} \right) + \frac{1}{2} f_2 \left( \frac{H}{H_\varphi + 2H_v} \right) - \frac{1}{2} f_2 \left( \frac{H}{H_\varphi} \right) \right\}, \quad (3)$$

где  $\sigma_0 = (D_{ii}/\bar{D})e^2/2\pi^2\hbar$ ,  $f_2(x) = \ln x + \Psi(1/2 + 1/x)$ ,  $\Psi$  — дигамма-функция. Характерные магнитные поля  $H_\varphi, H_v, H_\gamma$ , входящие в выражение (3), связаны с соответствующими временами релаксации фазы  $\tau_\varphi, \tau_v$  и  $\tau_\gamma$  соотношением

$$H_\alpha = \hbar c/4e\bar{D}\tau_\alpha, \quad (4)$$

где  $\alpha = \varphi, v, \gamma$ ,  $\bar{D} = (D_{zz}D_{xx})^{1/2}$  — усредненный по направлениям массовый коэффициент диффузии,  $\tau_\varphi$  — время релаксации фазы волнового состояния при неупругом рассеянии,  $\tau_v$  и  $\tau_\gamma$  — времена релаксации фазы при упругом рассеянии при междолинных и внутривалинных переходах соответственно. Последнее из них обратно пропорционально параметру  $\gamma_3$ , описывающему "тригональное искажение" траекторий Ферми  $2D$ -дырок на поверхности  $(10\bar{1}0)$ .

Связь компонент тензора коэффициента диффузии  $D_{zz}$  и  $D_{xx}$  с микроскопическими параметрами, входящими в матричный гамильтониан метода эффективной массы, в предположении о рассеянии на короткодействующем потенциале приведена в [5,6]. Там же с помощью соотношения Эйнштейна для вырожденного электронного газа

$$D_{ii} = p\mu_{ii}/e\Omega \quad (5)$$

найдена зависимость компонент тензора подвижности  $\mu_{xx}$  и  $\mu_{zz}$  от концентрации  $2D$ -дырок.

Выражение (3) описывает эффект СЛ, когда в  $2D$ -слое существует только одна  $2D$ -зона. При наличии нескольких  $2D$ -подзон необходимо учесть вероятность межподзонных переходов. Если время межподзонных переходов внутри каждой из долин значительно короче, чем времена, определяющие характерные магнитные поля  $H_\varphi, H_v, H_\gamma$ , происходит усреднение вкладов от всех

$2D$ -подзон пропорционально плотности состояний на уровне Ферми  $\Omega$ . при этом в (3), (4) все параметры должны быть заменены на средние [6]

$$D_{ii} = \frac{\sum_l D_{ii}^l \Omega_l}{\sum_l \Omega_l}, \quad \bar{D}_{ii} = \frac{\sum_l \bar{D}_{ii}^l \Omega_l}{\sum_l \Omega_l}, \quad \frac{1}{\tau_i} = \frac{\sum_l (1/\tau_i^l) \Omega_l}{\sum_l \Omega_l}. \quad (6)$$

Отметим, что формула (3) справедлива, если характерные магнитные поля  $H_\varphi$  не превосходят величину  $H_{tr}$ :  $H_{tr} = \hbar c/4e\bar{D}\tau_p$ , где  $\tau_p$  — время релаксации импульса. В магнитных полях  $H \sim H_{tr}$  явление слабой локализации сохраняется, но оно не носит диффузионного характера.

3) Анализ экспериментальных результатов. Рассчитанные теоретически зависимости, представленные на рис. 3, в сочетании с экспериментально найденными значениями концентрации  $p_l$  и  $\mu_{zz}^l$   $2D$ -дырок в каждой из подзон (см. таблицу) позволяют найти ряд характеристик, используемых в теории СЛ. Это плотность состояний  $\Omega_l$ , коэффициент диффузии на уровне Ферми  $D_{zz}^l$  и параметр  $(\tau_0^0)^l$ , определяющий время между упругими столкновениями, по порядку величины равный времени релаксации по импульсу  $\tau_0$  (см. таблицу). Далее, зная расчетное отношение  $\mu_{zz}^l/\mu_{xx}^l$  (см. [5,6]), можно от характеристик отдельных  $2D$ -подзон по формулам (6) перейти к усредненным параметрам, входящим в выражения (3), (4).

В работе [3] путем сравнения экспериментальных зависимостей  $\Delta\sigma(H)$  с формулой (3) был определен без учета анизотропии коэффициента диффузии параметр  $H_\varphi$ , ответственный за аномальное положительное магнетосопротивление, — третий член в формуле (3):  $H_\varphi(1.3\text{ K}) = 10\text{ Oe}$ . Что касается двух других слагаемых в (3), то их роль становится существенной в полях более 300 Oe. Это означает, что  $H_\varphi + 2H_v \approx H_\varphi + H_v + H_\gamma > 300\text{ Oe}$ . С другой стороны,

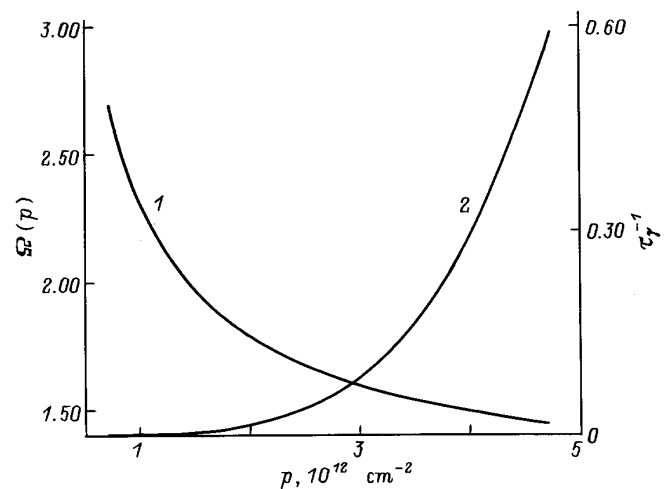


Рис. 3. Рассчитанные зависимости плотности состояний  $\Omega$  на уровне Ферми и величины  $(1/\tau_\gamma)$  от концентрации  $2D$ -дырок на поверхности теллура  $(10\bar{1}0)$ . 1 —  $\Omega \cdot 4\pi B_v$ , 2 —  $\frac{1}{\tau_\gamma} \gamma_3^2 \frac{100}{\tau_0^0} \left( \frac{A_v}{\Delta} \right)^3$ .

используя график 1 на рис. 1 в [6], определенные выше характеристики 2D-дырок и известную величину коэффициента  $\gamma_3$  ( $\gamma_3 = 2 \cdot 10^{-20} \text{ meV} \cdot \text{cm}^3$  (см., например, [1])), можно оценить  $\tau_\gamma$  и соответственно  $H_\gamma$ :  $\tau_\gamma \cong 10^{-12} \text{ s}$ ,  $H_\gamma \cong 20 \text{ Oe}$ . Отсюда следует, что

$$H_v > H_\varphi, H_\gamma, \quad (7)$$

причем  $H_v > 300 \text{ Oe}$ . Используя (4), можно также оценить характерные времена релаксации фазы  $\tau_\varphi$  и  $\tau_v$ . При этом оказывается, что

$$\tau_\varphi \sim \tau_\gamma > \tau_p, \tau_v,$$

т. е. для 2D-дырок на этой поверхности  $\tau_p \sim \tau_v$ . Строго говоря, в этом случае использованное нами диффузионное приближение для описания слабой локализации неприменимо. Однако можно показать, что, поскольку  $\tau_\varphi \gg \tau_p, \tau_v$ , наибольший вклад в  $\Delta\sigma(H)$  вносит только куперон, антисимметричный к перестановке долин. Его вклад в проводимость описывается третьим слагаемым в (3), в качестве параметра в котором содержится только  $H_\varphi$  (или  $\tau_\varphi$ ). Это означает, что в формуле (3) при сравнении с экспериментом следует удерживать только слагаемое  $-\frac{1}{2}f_2\left(\frac{H}{H_\varphi}\right)$ , а диапазон используемых при анализе магнитных полей ограничить величиной  $< 300 \text{ Oe}$ . Как показывают графики на рис. 2, такое описание действительно приводит к количественному согласию расчетных зависимостей с экспериментом в области слабых магнитных полей (вплоть до  $\sim 400 \text{ Oe}$ ). При этом вклад классического магнетосопротивления учитывался, как и в [1], введением дополнительного члена  $bH^2$ . Проведенная аппроксимация показала, что параметр  $H_\varphi$  уменьшается с уменьшением температуры. Значения  $H_\varphi$  при разных температурах представлены на рис. 2 (на врезке). Зависимость  $H_\varphi(T)$  можно аппроксимировать прямой линией, однако физически более обоснованной представляется аппроксимация вида

$$H_\varphi = A_\varphi T + B_\varphi T^2. \quad (8)$$

Метод наименьших квадратов дает  $A_\varphi = 9.66 \text{ Oe/K}$ , а  $B_\varphi = 2.7 \text{ Oe/K}^2$ . На рис. 4 представлены результаты расчета времени сбоя фазы  $\tau_\varphi(T)$  с использованием экспериментальных данных о  $H_\varphi$ , соотношений (4), (6) и значений коэффициента диффузии, приведенных в таблице. Линия на рис. 4 следует из (8)

$$1/\tau_\varphi = 1.58 \cdot 10^{11} T + 0.45 \cdot 10^{11} T^2 \text{ (s}^{-1}\text{)}. \quad (9)$$

Характер зависимости  $\tau_\varphi(T)$  указывает на то, что основным механизмом сбоя фазы волнового состояния дырки является межэлектронное взаимодействие (см., например, [9]). Первое слагаемое может быть связано с температурной зависимостью времени сбоя фазы при взаимодействии носителей с найквистовскими флуктуациями:  $(1/\tau_\varphi) \cong (1/\tau_\varphi^{(N)}) = T(\pi\sigma_0/\sigma_\square)(k/\hbar) \ln(\sigma_\square/2\pi\sigma_0)$  [9]. Расчет с использованием параметров 2D-дырок, приведенных в таблице, дает  $(1/\tau_\varphi^{(N)}) \cong (T/1\text{K}) \cdot 10^{10} \text{ s}^{-1}$ ,

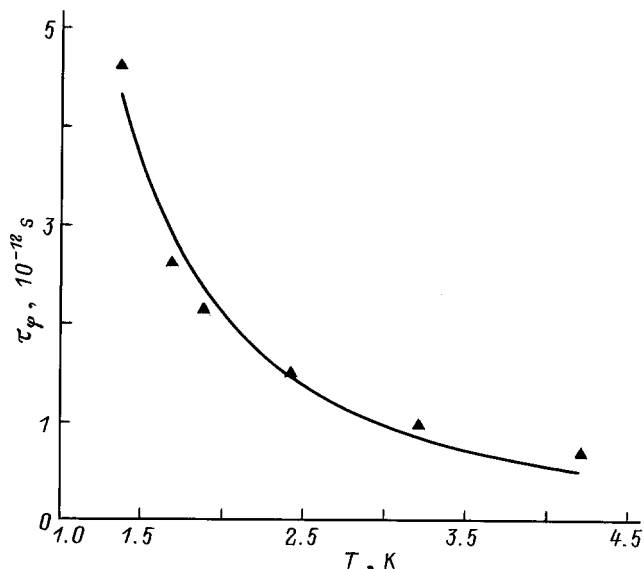


Рис. 4. Температурная зависимость времени сбоя фазы  $\tau_\varphi$ . Темные треугольники — эксперимент, сплошная линия — аппроксимация.

что находится в качественном соответствии с найденной экспериментально величиной.

В более сильных магнитных полях экспериментальные величины  $\Delta\sigma(H)$  оказываются выше расчетных из-за вклада в эффект СЛ процессов рассеяния с упругими переходами, приводящими в магнитном поле к уменьшению магнетосопротивления.

Таким образом, при описании эффекта аномального положительного магнетосопротивления 2D-слоя на поверхности теллура ( $10\bar{1}0$ ) в рамках микроскопической теории слабой локализации [5,6] выявлена необычайно высокая вероятность межподзонных переходов при упругом рассеянии 2D-дырок, что качественно отличает этот случай от системы 2D-дырок на ранее изученной поверхности (0001). В предположении, что рассеяние происходит в основном на шероховатостях поверхности, обнаруженное различие естественно связать с различным характером электронных состояний на этих поверхностях: на поверхности (0001) ненасыщенные ковалентные связи на концах цепочек, образующих кристалл теллура, и нарушение более слабых связей типа Ван-дер-Ваальса между цепочками в случае поверхности ( $10\bar{1}0$ ), являющейся поверхностью скола.

В заключение авторы благодарят А.О. Смирнова, принимавшего участие в ряде экспериментов, и И.А. Беспалова за проведенные расчеты.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 96-02-16959 и 96-02-17849), Программы "Физика твердотельных наноструктур" № 97-1035, Программы поддержки молодых докторов наук № 96-15-96955 и ФЦП "Интеграция" № 326.37.

## Список литературы

- [1] В.А. Березовец, И.И. Фарбштейн, А.Л. Шеланков. Письма в ЖЭТФ **39**, 2, 64 (1984).
- [2] A.L. Shelankov. Solid State Commun. **53**, 5, 465 (1985).
- [3] В.А. Березовец, Ю.Б. Лянда-Геллер, А.О. Смирнов, И.И. Фарбштейн. Письма в ЖЭТФ **58**, 10, 822 (1993).
- [4] V.A. Berezovets, I.I. Farbshtein, A.O. Smirnov. Phys. Low-Dim. Struct. **12**, 301 (1995).
- [5] Н.С. Аверкиев, Г.Е. Пикус. ФТТ **38**, 6, 1748 (1996).
- [6] Н.С. Аверкиев, Г.Е. Пикус. ФТТ **39**, 9, 1659 (1997).
- [7] В.А. Березовец, Д.В. Машовец, А.О. Смирнов, Д.В. Смирнов, И.И. Фарбштейн. ФТТ **33**, 12, 3502 (1991).
- [8] М.С. Бреслер, В.Г. Веселаго, Ю.В. Косичкин, Г.Е. Пикус, И.И. Фарбштейн, С.С. Шалыт. ЖЭТФ **57**, 1479 (1969).
- [9] V.L. Altshuler, A.G. Aronov, D.E. Khmel'nitsky. J. Phys. **C5**, 7367 (1982).